

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Беспалов Владимир Александрович

Должность: Ректор МИЭТ

Дата подписания: 01.09.2023 15:48:35

Уникальный программный ключ:

ef5a4fe6ed0ffdf7f1a49d6ad1b49464dc1bf7354f736d76c8f9bce882b8d602

Аннотация рабочей программы дисциплины

«Сканирующая зондовая микроскопия»

Направление подготовки: 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»

Направленность (профиль): «Элементная база наноэлектроники»

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является достижение студентами ясного понимания конструкции сканирующих зондовых микроскопов, понимания реальности изменения ее под нужды эксперимента, а также появление у студентов веры в возможность создания сложного экспериментального оборудования, к которому относятся сканирующие зондовые микроскопы, своими собственными руками.

Задачами дисциплины являются освоение физических принципов работы отдельных составляющих сканирующих зондовых микроскопов – туннельного и атомно-силового зонда, пьезосканера, пьезоинерциального двигателя, системы амортизации, лазерной системы слежения за зондом и других, приобретение навыков по сборке микроскопов из этих составляющих, а также приобретение опыта по включению, настройке самостоятельно собранных микроскопов, выбору рабочих параметров и получению кадров.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока «ФТД.Факультативы» образовательной программы.

Для её освоения требуются знания, умения и опыт деятельности, приобретаемые студентами при изучении следующих дисциплин: Математический анализ; Физика. Электричество и магнетизм; Физика. Атомная физика и строение вещества; Теория вероятностей и математическая статистика, Физика конденсированного состояния, Наноэлектроника.

3. Краткое содержание дисциплины

Модуль 1. Конструирование сканирующего зондового микроскопа.

1. История открытия и развития конструкций сканирующих зондовых микроскопов. Сканирующий туннельный микроскоп: конструкция.
2. Получение атомарного разрешения в сканирующем туннельном микроскопе.
3. Сканирующий атомно-силовой микроскоп, получение атомарного разрешения в атомно-силовом микроскопе.

Модуль 2 Экспериментальные методики сканирующей зондовой микроскопии

1. Методы обработки и анализа кадров сканирующей зондовой микроскопии.
2. Методики получения физических характеристик образца в сканирующих зондовых микроскопах.

Разработчик:

Старший преподаватель каф. КФН



/ А. Е. Широков /